

JIS

光学素子及び光学システム用の製図手法— 第5部：表面形状公差

JIS B 0090-5 : 2010
(ISO 10110-5 : 2007)
(JOIA/JSA)

平成 22 年 5 月 20 日 改正

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

日本工業標準調査会標準部会 計測計量技術専門委員会 構成表

| | 氏名 | 所属 |
|--------|---------|------------------|
| (委員長) | 田 中 充 | 独立行政法人産業技術総合研究所 |
| (委員) | 生 田 一 男 | 社団法人日本計量機器工業連合会 |
| | 石 崎 法 夫 | 独立行政法人製品評価技術基盤機構 |
| | 市 原 裕 | 株式会社ニコン |
| | 大 園 成 夫 | 東京電機大学 |
| | 河 野 嗣 男 | 東京都立科学技術大学名誉教授 |
| | 秦 康 之 | 環境省 |
| | 前 田 哲 也 | 日本精密測定機器工業会 |
| | 吉 原 順 二 | 社団法人日本電気計測器工業会 |
| (専門委員) | 野 原 慈 久 | 財団法人日本規格協会 |

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：平成 13.3.20 改正：平成 22.5.20

官 報 公 示：平成 22.5.20

原 案 作 成 者：日本光学工業協会

(〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 TEL 03-3431-7073)

財団法人日本規格協会

(〒107-8440 東京都港区赤坂 4-1-24 TEL 03-5770-1571)

審 議 部 会：日本工業標準調査会 標準部会 (部会長 二瓶 好正)

審議専門委員会：計測計量技術専門委員会 (委員長 田中 充)

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者又は経済産業省産業技術環境局 基準認証ユニット産業基盤標準化推進室 (〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1) にご連絡ください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第 15 条の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

目 次

| | ページ |
|---------------------------------------|-----|
| 序文..... | 1 |
| 1 適用範囲..... | 1 |
| 2 引用規格..... | 1 |
| 3 用語及び定義..... | 2 |
| 4 表面形状偏差に対する公差の指示..... | 2 |
| 4.1 一般..... | 2 |
| 4.2 単位..... | 2 |
| 4.3 波長..... | 2 |
| 5 図面指示..... | 3 |
| 5.1 一般..... | 3 |
| 5.2 コード番号..... | 3 |
| 5.3 指示方法..... | 3 |
| 5.4 位置..... | 4 |
| 6 公差指示の例..... | 4 |
| 附属書 A (参考) サジッタ偏差の公差と曲率半径の公差との関係..... | 6 |
| 解 説..... | 7 |